Работа 3.3.4 Эффект Холла в полупроводниках

Гаврилин Илья Дмитриевич Б01-101

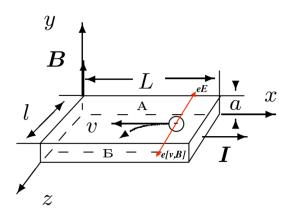
15 ноября 2022 г.

1 Аннотация

В данной работе изучили эффект Холла на образце из германия. Замерили ЭДС Холла при различных значениях магнитной индукции, получили значение подвижности носителей тока и их концентрации. Оценили погрешности полученных величин.

2 Теоретическая справка

Суть эффекта Холла состоит в следующем. Пусть через однородную пластину металла вдоль оси x течет ток I (рис. 1).



Если эту пластину поместить в магнитное поле, направленное по оси у, то между гранями A и Б появляется разность потенциалов.

В самом деле, на электрон (для простоты рассматриваем один тип носителей), движущийся со средней скоростью $\langle \vec{v} \rangle$ в электромагнитном поле, действует сила Лоренца:

$$\vec{F}_{\mbox{\tiny $\rm I$}} = -e \vec{E} - e \langle \vec{v} \rangle \times \vec{B}, \label{eq:F_II}$$

Рис. 1: Образец с током в магнитном поле на, \vec{E} - напряженность электрического поля, \vec{B} - индукция магнитного поля.

В проекции на ось z получаем

$$F_B = e|\langle v_x \rangle|B.$$

Под действием этой силы электроны отклоняются к грани Б, заряжая ее отрицательно. На грани А накапливаются нескомпенсированные положительные заряды. Это приводит к возникновению электрического поля E_z , направленного от А к Б, которое действует на электроны с силой $F_E=eE_z$. В установившемся режиме $F_E=F_B$, поэтому накопление электрических зарядов на боковых гранях пластины прекращается. Отсюда

$$E_z = |\langle v_x \rangle| B.$$

С этим полем связана разность потенциалов

$$U_{AB} = E_z l = |\langle v_x \rangle| B l.$$

В этом и состоит эффект Холла.

Замечая, что сила тока

$$I = ne|\langle v_x \rangle| la$$
,

найдем ЭДС Холла:

$$\mathscr{E}_X = U_{AB} = \frac{IB}{nea} = R_X \frac{IB}{a} \tag{1}$$

Константа $R_X = \frac{1}{ne}$ называется постоянной Холла.

В полупроводниках, когда вклад в проводимость обусловлен и электронами и дырками, выражение для постоянной Холла имеет более сложный вид:

$$R_X = \frac{nb_e^2 - pb_p^2}{e(nb_e + pb_p)^2},$$

где n и p - концентрации электронов и дырок, b_e b_p - их подвижности.

3 Ход работы

- 1) Подготовим экспериментальную установку в соответствии с описанием.
- 2) Изучим характеристики установки: $I_{max}=2~A,~a=1.5\pm0.1~mm,~L_{3,5}=3.0\pm0.1~mm,~l=1.7\pm0.1~mm,~SN=75~{\rm cm}^2$ вит, $r_{\rm внш}=5~Ohm.$

Градуировка магнита

3) Проведем градуировку оборудования.

U, B	13.2	26.8	40.4	53.6	67	80.9	94.8	109
I, A	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
Φ_1 , mWb	4.10	5.20	6.30	7.30	8.25	8.90	9.50	9.90
Φ_2 , mWb	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	3.00	3.10
$\Delta\Phi$, mWb	1.20	2.30	3.40	4.40	5.35	6.00	6.50	6.80
В, Тл	0.160	0.307	0.453	0.587	0.713	0.800	0.867	0.907

Таблица 1: Градуировка электромагнита

Рассчитав погрешность получаем: $\Delta B = 0.007 \text{ Тл.}$

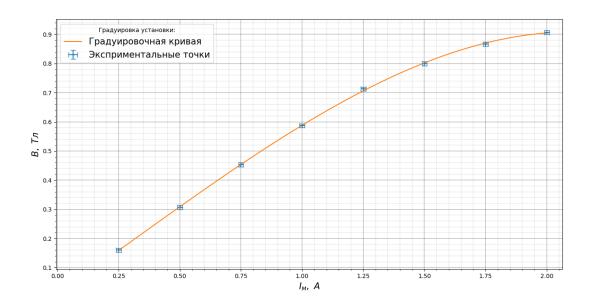


Рис. 2: Градуировка магнита

Измерение ЭДС Холла

	В, Тл	0.000	0.160	0.307	0.453	0.587	0.713	0.800	0.867	0.907
I=0.3 mA	U, мВ	-0.026	-0.043	-0.066	-0.089	-0.109	-0.126	-0.140	-0.149	-0.156
1-0.5 IIIA	ε_x , мВ	0.000	-0.017	-0.040	-0.063	-0.083	-0.100	-0.114	-0.123	-0.130
I=0.4 mA	U, мВ	-0.028	-0.058	-0.090	-0.119	-0.148	-0.172	-0.189	-0.201	-0.210
1-0.4 IIIA	ε_x , мВ	0.000	-0.030	-0.062	-0.091	-0.120	-0.144	-0.161	-0.173	-0.182
I=0.5 mA	U, мВ	-0.036	-0.073	-0.112	-0.150	-0.183	-0.214	-0.236	-0.251	-0.263
1-0.5 IIIA	ε_x , мВ	0.000	-0.037	-0.076	-0.114	-0.147	-0.178	-0.200	-0.215	-0.227
I=0.6 mA	U, мВ	-0.043	-0.087	-0.135	-0.179	-0.220	-0.257	-0.283	-0.301	-0.316
1-0.0 IIIA	ε_x , м ${ m B}$	0.000	-0.044	-0.092	-0.136	-0.177	-0.214	-0.240	-0.258	-0.273
I=0.7 mA	U, мВ	-0.050	-0.102	-0.158	-0.209	-0.257	-0.300	-0.330	-0.351	-0.367
1-0.7 IIIA	ε_x , м ${ m B}$	0.000	-0.052	-0.108	-0.159	-0.207	-0.250	-0.280	-0.301	-0.317
I=0.8 mA	U, мВ	-0.057	-0.118	-0.179	-0.240	-0.293	-0.342	-0.376	-0.401	-0.420
1-0.6 IIIA	ε_x , мВ	0.000	-0.061	-0.122	-0.183	-0.236	-0.285	-0.319	-0.344	-0.363
I=0.9 mA	U, мВ	-0.064	-0.130	-0.201	-0.270	-0.331	-0.383	-0.425	-0.451	-0.473
1-0.9 IIIA	ε_x , мВ	0.000	-0.066	-0.137	-0.206	-0.267	-0.319	-0.361	-0.387	-0.409
I=1 mA	U, мВ	-0.061	0.013	0.089	0.160	0.225	0.280	0.321	0.350	0.371
	ε_x , мВ	0.000	0.074	0.150	0.221	0.286	0.341	0.382	0.411	0.432

Таблица 2: Измерение ЭДС Холла

 ε_x подсчитали как разность с показанием напряжения при выключенном магните.

Поиск коэффициентов наклона

По полученным данным построим графики зависимости $\varepsilon_x = f(B)$, аппроксимируем экспериментальные точки прямой, получим угловые коэффициенты наклона.

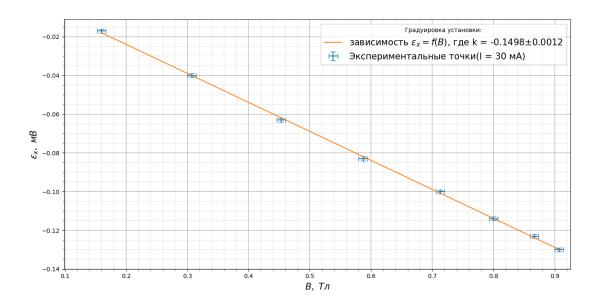


Рис. 3: Зависимость ЭДС Холла от В

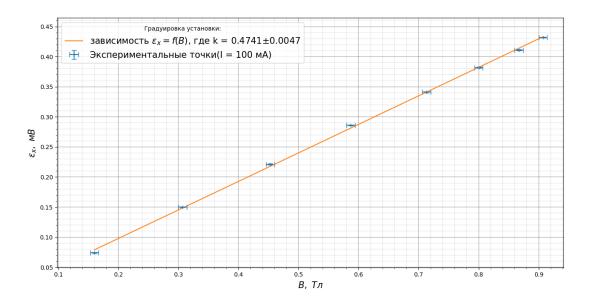


Рис. 4: Зависимость ЭДС Холла от В, при реверсивной полярности

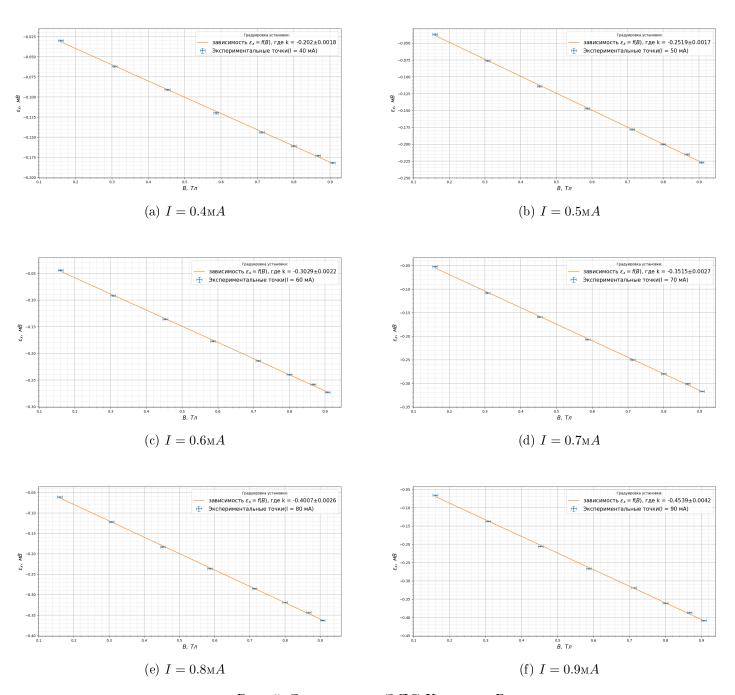


Рис. 5: Зависимость ЭДС Холла от В

Зависимость коэффициента наклона от тока

I, MA	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
$k \cdot 10^{-3}, \mathrm{B/Tл}$	0.1498	0.202	0.2519	0.3029	0.3515	0.4007	0.4539	0.4741
$\Delta k \cdot 10^{-3}$, В/Тл	0.0012	0.0018	0.0017	0.022	0.0027	0.0026	0.0022	0.0047

Таблица 3: Зависимость коэффициента наклона от тока текущего через образец

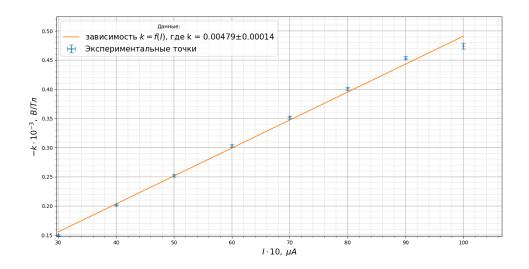


Рис. 6: Зависимость к от тока протекающего через образец

```
Получили k=0.479\pm0.014~\mathrm{B/T\pi} * А. Тогда: R_x=(7.2\pm0.4)*10^{-4}~\mathrm{m}^3/\mathrm{K}л, тогда n=(868\pm1)\cdot10^{19}~\mathrm{m}^3. \sigma=(692\pm1.2)~(\mathrm{Om\cdot m})^{-1} b=\frac{\sigma}{en}=(5000\pm50)\frac{\mathrm{cm}^2}{\mathrm{B}\cdot c}
```

4 Выводы

- 1) Тип носителей заряда дырочный.
- 3) Нашли Все требуемые характеристики полупроводника (см п.3 Зависимость коэффициента наклона от тока).